



	QS001	W50-CPU0	W50-CPU1	QS90SRx	MR-J3-D05	MR-J3-BSafety	MR-J4-A/B	FR-E700	FR-D700
Category	cat. 4 (EN 954-1)	cat. 4 (EN 954-1)	cat. 4 (EN 954-1)	cat. 4 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)
Safety Integrity Level	SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061)	SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061)	SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061)	—	SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)	SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)	SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)	SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)	SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)
Performance Level	PL e (EN ISO 13849-1)	PL e (EN ISO 13849-1)	PL e (EN ISO 13849-1)	PL e (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)
Safety function	—	—	—	—	STO/SS1 (EN 61800-5-2) cat. 0/1 (EN 60204-1)	STO (EN 61800-5-2) cat. 0 (EN 60204-1)	STO (EN 61800-5-2) cat. 0 (EN 60204-1)	STO (EN 61800-5-2) cat. 0 (EN 60204-1)	STO (EN 61800-5-2) cat. 0 (EN 60204-1)
MTTFd Expectation of the average time for a dangerous failure to occur	71 years	100 years	100 years	100 years	516 years	100 years	100 years	504 years	725 years
DC Diagnostic Coverage is the effectiveness of fault monitoring of a system or subsystem	99 %	99 %	99 %	99 %	93 %	90 %	90 %	60 %	60 %
PFHd Expectation time (average probability) of dangerous failure taking place during one (1) hour	4,95E-09 1/h	1,07E-09 1/h	1,69E-09 1/h	—	1,01E-07 1/h	1,01E-07 1/h	1,01E-07 1/h	4,59E-09 1/h	2,35E-09 1/h



	RV-1A/2AJ RP-xAH	RV-S RH-S	RV-SD RH-SD	RV-SQ RH-SQ	RH-F
Category	cat. 2 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)	cat. 3 (EN 954-1)
Safety Integrity Level	—	—	—	—	—
Performance Level	PL c (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)	PL d (EN ISO 13849-1)
Safety function	—	—	—	—	—
MTTFd Expectation of the average time for a dangerous failure to occur	100 years	97 years	56 years	56 years	57 years
DC Diagnostic Coverage is the effectiveness of fault monitoring of a system or subsystem	50 %	99 %	95 %	95 %	90 %
CCF Common Cause Failure-A situation where several subsystems fail due to a single event	75	75	75	75	75